

Сведения о научном руководителе
по диссертации Кудина Дмитрия Владимировича
«Повышение быстродействия логических схем за счет выявления ложных путей
и синтеза схем, в которых задержки каждого пути обнаружимы»
по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации
(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации)
на соискание ученой степени кандидата технических наук

Наименование организации, дата и номер приказа о назначении научным руководителем	Приказ по Геофизическому центру Российской академии наук от 26.04.2018 № 33-О
Фамилия, имя, отчество	Матросова Анжела Юрьевна
Гражданство	Гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра и наименования научной специальности и отрасли науки, по которым защищена диссертация)	Доктор технических наук, 05.13.01 – Управление в технических системах
Ученое звание (по какой кафедре / по какой специальности)	Профессор по кафедре программирования
Основное место работы	
Почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта организации	634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, (3822) 52-98-52, rector@tsu.ru, http://tsu.ru
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Наименование подразделения (кафедра / лаборатория)	Кафедра программирования
Должность	Профессор
Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	
1.	Матросова А. Ю. Обнаружение ложных путей в последовательностных схемах / А. Ю. Матросова, В. В. Андреева, С. В. Чернышов, С. В. Рожкова, Д. В. Кудин // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т. 60, № 10. – С. 170–178. <i>в переводной версии журнала, входящей в Web of Science:</i> Matrosova A. Y. Finding False Paths in Sequential Circuits / A. Y. Matrosova, V. V. Andreeva, S. V. Chernyshov, S. V. Rozhkova, D. V. Kudin // Russian Physics Journal. – 2018. – Vol. 60, №. 10. – P. 1837–1844. – DOI: 10.1007/s11182-018-1290-0.
2.	Матросова А. Ю. Построение тестовых пар для неисправностей задержек путей в логических схемах с использованием операций над ROBDD-графами / А. Ю. Матросова, В. В. Андреева, Е. А. Николаева // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. – Т. 61, № 5 (725). – С. 169–173. <i>в переводной версии журнала, входящей в Web of Science:</i> Matrosova A. Finding Test Pairs for PDFs in Logic Circuits Based on Using Operations on ROBDDs / A. Y. Matrosova, V. V. Andreeva, E. A. Nikolaeva // Russian Physics Journal. – 2018. – Vol. 61, is. 5. – P. 994–999. – DOI: 10.1007/s11182-018-1488-1.
3.	Matrosova A. Y. Detection and masking of trojan circuits in sequential logic / A. Y. Matrosova, E. V. Mitrofanov, S. A. Ostanin, N. B. Butorina, E. G. Pahomova,

	<p>S. A. Shulga // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2018. – № 42. – С. 89–99. – DOI: 10.17223/19988605/42/10.</p> <p><i>Web of Science</i>: Matrosova A. Y. Detection and masking of trojan circuits in sequential logic / A. Y. Matrosova, E. V. Mitrofanov, S. A. Ostanin, N. B. Butorina, E. G. Pahomova, S. A. Shulga // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta-Upravlenie Vychislitel'naja Tehnika i Informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. – 2018. – № 42. – P. 89–99.</p>
4.	<p>Shah T. Test Pattern Generation to Detect Multiple Faults in ROBDD based Combinational Circuits / T. Shah, A. Matrosova, V. Singh // 23rd IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design (IOLTS) : proceedings paper. Thessaloniki, Greece, July 03–05, 2017. – New York, 2017. – P. 211–212. (<i>Web of Science</i>).</p>
5.	<p>Matrosova A. Y. Trojan Circuits Preventing and Masking in Sequential Circuits / A. Matrosova, E. Mitrofanov, S. Ostanin, I. Kirienko // 23rd IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design (IOLTS) : proceedings paper. Thessaloniki, Greece, July 03–05, 2017. – New York, 2017. – P. 213–214. (<i>Web of Science</i>).</p>
6.	<p>Матросова А. Ю. A Fault-tolerant Sequential Circuit Design for Stuck-at Faults and Path Delay Faults / A. Y. Matrosova, S. A. Ostanin, I. E. Kirienko, E. A. Nikolaeva // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2017. – № 41. – С. 61–68. – DOI: 10.17223/19988605/41/8.</p> <p><i>Web of Science</i>: Matrosova A. Y. A Fault-tolerant Sequential Circuit Design for Stuck-at Faults and Path Delay Faults / A. Y. Matrosova, S. A. Ostanin, I. E. Kirienko, E. A. Nikolaeva // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta-Upravlenie Vychislitel'naja Tehnika i Informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. – 2017. – № 41. – P. 61–68.</p>
7.	<p>Matrosova A. Y. Simplification of fully delay testable combinational circuits and finding of PDF test pairs / A. Y. Matrosova, E. V. Mitrofanov, T. Shah // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2017. – № 39. – С. 85–93.</p> <p><i>Web of Science</i>: Matrosova A. Y. Simplification of fully delay testable combinational circuits and finding of PDF test pairs / A. Y. Matrosova, E. V. Mitrofanov, T. Shah // Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta-Upravlenie Vychislitel'naja Tehnika i Informatika – Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. – 2017. – № 39. – P. 85–93.</p>
8.	<p>Матросова А. Ю. Синтез частично программируемых схем, ориентированный на маскирование вредоносных подсхем (Trojan Circuits) / А. Ю. Матросова, С. А. Останин, Е. А. Николаева // Труды / Институт системного программирования РАН. – Москва, 2017. – Т. 29, № 5. – С. 61–73. – DOI: 10.15514/ISPRAS-2017-29(5)-4.</p>
9.	<p>Ahlawat S. A High Performance Scan Flip-Flop Design for Serial and Mixed Mode Scan Test / S Ahlawat, V. Singh, J. Tudu, A. Matrosova // 22nd IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design, IOLTS 2016 : proceedings paper. Sant Feliu de Guixols, Catalunya, Spain, July 04–06, 2016. – New York, USA, 2016. – P. 233–238. – DOI: 10.1109/IOLTS.2016.7604709. (<i>Web of Science</i>).</p>
10.	<p>Ahlawat S. A New Scan Flip Flop Design to Eliminate Performance Penalty of Scan / S. Ahlawat, V. Singh, J. Tudu, A. Matrosova // 24th IEEE Asian Test Symposium : proceedings paper. Mumbai, India, November 22–25, 2015. – New York, 2015. – Series : Asian Test Symposium Proceedings. – P. 25–30. – DOI 10.1109/ATS.2015.1. (<i>Web of Science</i>).</p>

11.	Matrosova A. A Fault-tolerant Sequential Circuit Design for SAFs and PDFs Soft Errors / A. Matrosova, S. Ostanin, I. Kirienko, E. Nikolaeva // 22nd IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design (IOLTS) : proceedings paper. Sant Feliu de Guixols, Catalunya, Spain, July 04–06, 2016. – New York, 2016. – P. 5–6. – 10.1109/IOLTS.2016.7604658. (<i>Web of Science</i>).
12.	Matrosova A. Patching Circuit Design Based on Reserved CLBs / A. Matrosova, S. Ostanin, V. Andreeva // IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR : proceedings paper. Cluj-Napoca, Romania, May 19–21, 2016. – New York, 2016. – P. 49–53. – DOI: 10.1109/AQTR.2016.7501284. (<i>Web of Science</i>).
13.	Matrosova A. ROBDDs Application for Finding the Shortest Transfer Sequence of Sequential Circuit or Only Revealing Existence of this Sequence without Deriving the Sequence itself / A. Matrosova, V. Andreeva, A. Melnikov // IEEE East-West Design and Test Symposium (EWDTS) : proceedings paper. Yerevan, Armenia, October 14–17, 2016. – New York, 2016. – 4 p. – DOI: 10.1109/EWDTS.2016.7807674. (<i>Web of Science</i>).
14.	Matrosova A. Combinational Circuits without False Paths / A. Matrosova, D. Kudin, E. Nikolaeva // IEEE East-West Design and Test Symposium (EWDTS 2014) : proceedings paper. Kiev, Ukraine, September 26–29, 2014. – New York, USA, 2014. – P. 179–184. (<i>Web of Science</i>).

Научный руководитель

06 ноября 2018 г.

Верно

Ученый секретарь Ученого совета ТГУ

А. Ю. Матросова



Н. А. Сазонтова